**Cadre de réponse technique**

**Marché - lot n°2, MEB**

**Nom du candidat :……………………………………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Informations souhaitées** | **Réponses** |
| **45%** | **Spécifications techniques** | |
| 2% | Nature et dimensions de l’équipement | |
| 0% | Matériel : description (type, modèle etc…) |  |
| 1% | Dimensions minimales de la salle (L x l x h) |  |
| 1% | Dimensions de l’équipement complet et emprise au sol |  |
| 2% | Chambre | |
| 1% | Dimensions internes (Largeur x Profondeur x hauteur, en mm) |  |
| 1% | Dimensions maximales des échantillons (L x l x h, ou D x h, en mm) |  |
| 2% | Passages et ouvertures | |
| 1% | Nombre total de ports et ouvertures |  |
| Nombre de ports compatibles EDS |  |
| Nombre de ports compatibles EBSD |  |
| Présence d’une caméra IR |  |
| 1% | Présence de passage électrique permettant le branchement de machine d’essais in-situ |  |
| 5% | Vide | |
| 1% | Vide poussé / valeur de vide (Pa) |  |
| 3% | Vide partiel / valeur de vide (Pa) |  |
| Possibilité d’imagerie environnementale |  |
| 1% | Système de pompage commandé par procédures automatiques |  |
| 9% | Platine et porte-échantillons | |
| 0% | Nature des mouvements de la platine (eucentrique, cartésien…) |  |
| 1% | WD analytique (mm) |  |
| Gamme de WD analytique, si ajustable (mm) |  |
| 1% | Course en X (mm) |  |
| Course en Y (mm) |  |
| Course en Z (mm) |  |
| Angle de rotation (°) |  |
| 2% | Angle de tilt : min – max (°) |  |
| 2% | Poids max supporté par la platine à plat (kg) |  |
| Poids max supporté par la platine tiltée (kg) |  |
| 0% | Pilotage de la platine intégré aux fonctions de base par interfaçage informatique possible ? |  |
| 2% | Mémorisation de position |  |
| Automatisation des séquences d’acquisition |  |
| 1% | Nombre de porte-échantillons fournis et mode d’utilisation détaillé |  |
| 10% | Performances générales | |
| 3% | Gamme de tension d’accélération |  |
| 1% | Gamme de courant de sonde |  |
| 3% | Résolution spatiale en SE et vide poussé à 30 kV |  |
| 1% | à 3 kV |  |
| 2% | à 1 kV |  |
| 0% | Résolution en vide partiel (si applicable) |  |
| 0% | Résolution en environnemental (si applicable) |  |
| 0% | Gamme de grandissement |  |
| 0% | Taille de champ (X,Y) à la WD analytique (mm) |  |
| 6% | Optique électronique et fonction de balayage | |
| 0% | Nature du filament, pointe, ou canon |  |
| 1% | Nombre de filaments / pointes fournies |  |
| 1% | Mise au point continue |  |
| 1% | Réglage du plan de focalisation (échantillons inclinés) |  |
| 0% | Autofocus |  |
| 0% | Nombre de diaphragmes objectifs |  |
| 0% | Modes de contrôle du faisceau |  |
| 1% | Moyennage/intégration |  |
| 1% | Mode spot et ligne |  |
| 1% | Présence interfaçage informatique pour système EDS-X et EBSD (interfaces, câbles…) |  |
| 8% | Détecteurs | |
| 2% | Electrons secondaires / type |  |
| 3% | Electrons rétrodiffusés / type |  |
| 0% | Mixage des signaux |  |
| 3% | Détecteur EDS / modèle |  |
| Taux de comptage à WD analytique (ordre de grandeur à des U et I donnés) |  |
| Suite logiciel EDS |  |
| Mode d’analyses EDS (carto, pointés, profils, cartos quanti…) |  |
| Méthodes de quanti. disponibles dans la suite logiciel |  |
| 1% | Acquisition - Images/Affichage | |
| 1% | Résolution numérique maximale (px x px) |  |
| Fonctions d’affichage (détailler info. bandeau) |  |
| Fonctions de stockage (tiff, bmp, png, jpeg…) |  |
| 0% | Autres équipements et prestations | |
|  | Autres détecteurs (caractéristiques) |  |
|  | Autres systèmes (caractéristiques) |  |
|  | Bureautique (clavier, souris, écrans…) |  |
|  | Autres |  |
| **10%** | **Modalités d’exécution du marché, formations, garantie, support, SAV** | |
| 3% | Modalités marché (livraison, installation, mise en service, formation) |  |
| 3% | Durée de la garantie |  |
| Détails garantie |  |
| 1% | Nombre de visite de maintenance assurée pendant la période de garantie (hors panne) |  |
| 1% | Modalités du support technique/SAV (contact, délai… à détailler) |  |
| 2% | Nombre de personnes max. à la formation MEB |  |
| Nombre de jours de formation MEB |  |
| Contenu de la formation |  |
| 0% | Fourniture des plans côtés de la chambre et de la platine |  |
| 0% | Autres |  |
| **10%** | **Développement durable** | |
| 2% | Consommation électrique |  |
| 4% | Durée garantie de disponibilité des pièces détachée |  |
| 4% | Durée garantie du support logiciel |  |
|  | **Prestation supplémentaires éventuelles en option** | |
|  | Métalliseur (oui/non, modèle) |  |
|  | Système EBSD et services associés (oui/non, modèle) |  |
|  | Extension de garantie d’un an |  |
|  | Contrat de maintenance 1 an renouvelable 1 an |  |
|  | **Autres informations importantes ne rentrant pas dans les cadres précédents** | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |